

Surface Analyzer System

Der VEW „Surface Analyzer“ basiert auf dem Prinzip der phasenmessenden Deflektometrie, mit der spiegelnde Oberflächen mit hoher Auflösung gemessen und beurteilt werden können. Bei der Methode wird das im Objekt gespiegelte Bild eines Streifenmusters, das auf einem Referenzbildschirm dargestellt wird, von einer Kamera aufgenommen. Aus der Verformung des Musters durch die Objektoberfläche kann eine Karte der Oberflächengradienten berechnet werden.



VEW-GmbH hat diese Methode in ein kompaktes Messsystem integriert, mit einer Größe von 330 x 290 x 315mm.

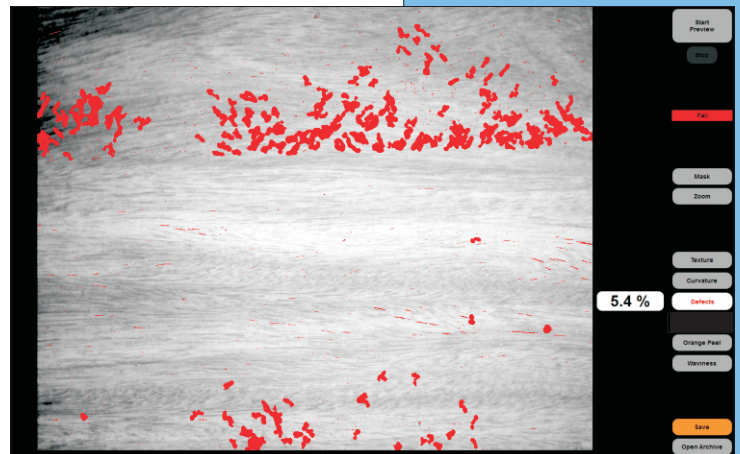
Das System wird auf dem Messobjekt mit Vakuumfüßen fixiert, auch vertikal. Das System kann sowohl am Netz als auch vollständig netzunabhängig mit den integrierten LiPo-Akkumulatoren betrieben werden.

Auf der Oberseite des Geräts befindet sich ein Touchscreen, auf dem sich eine vom Benutzer intuitiv bedienbare Oberfläche befindet, die sowohl eine einfache Durchführung einer Messung als auch eine leichte Auswertung der gemessenen Daten erlaubt.

Die Auswertung kann nach unterschiedlichen Kriterien wie Textur, Krümmung, Defektanalyse, Welligkeit und Orangenhaut erfolgen.

Durch den Benutzer können individuelle Grenzen für die einzelnen Kriterien festgelegt werden, bei deren Überschreitung die jeweiligen Bereiche rot markiert werden.

Das System kann für unterschiedliche Anwendungen optimal angepasst werden.



Technische Daten:

Gehäuse	: kombiniertes Kohlefaser-/Aluminiumprofilgehäuse mit integriertem Touch Screen Befestigung auf der Objektoberfläche mit Vakuumfüßen
Stromversorgung	: Akkumulator (12V und/oder Netzanschluss 230V, 50Hz)
Kamera	: CCD 1624 x 1234 pixel, Bildrate: 14Hz

Systemdaten:

Abmessungen	: 330 x 290 x 315mm
Messbereich	: ca. 75 x 60mm
Tiefenauflösung	: <10nm
Krümmung	: <0.05D
Messzeit	: 5...100s



DIE ENTWICKLER

VEW Vereinigte Elektronikwerkstätten GmbH
Edisonstraße 19 * POb: 330543 * 28357 Bremen
Fon: (+49) 0421/271530 Fax: (+49) 0421/273608
E-Mail: VEW-GmbH-Bremen@t-online.de